光照射を含む複合加速試験の実施と劣化メカニズムの調査

辺田 祐志¹·Ngo T. H. Trang¹·土井 卓也²· 增田 淳²

デュポン株式会社(太陽光発電技術研究組合,2015年2月まで出向)
国立研究開発法人産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター

研究の背景・目的

AIST

近年、PVモジュールの長期信頼性と耐久性を適切に評価する試験方法の開発 が強く望まれている。長期屋外曝露されたモジュールを構成する高分子材料の 劣化に紫外線が大きく影響していることが強く示唆されているが、現行IEC試験 では、紫外線照射によるモジュールの劣化を十分に評価することが出来ていな いため、紫外線耐性に劣るモジュールが量産・出荷されている可能性が高い 本研究では、紫外線照射試験と現行IEC試験の組み合わせ、および各々の単一 試験を実施することにより、紫外線が出力低下やモジュール劣化に影響を与え ていることを確認した。

実験方法 サンプル

単セルモジュール 白板半強化ガラス, Fast cure EVA, 多結晶シリコンセル, パックシート(PVF/PET/PVF), からなるラミネート品を Aフレーム、およびシリコンシーラントにて端面封止



* 紫外線照射: キセノンランプ:90W/m² at 300-400nm, 槽内温度65℃(モジュール温度80~90℃),湿度制御なし,端子接続なし(開放) DH試験: 85℃、85%RH

Hot試験: 90℃

試験条件



✓ 紫外線照射により生じた封止材(EVA)の何らかの劣化が、その後のDH試験での酢酸発生量 に大きく影響を及ぼすことが確認された

【今後の課題】

- ✓ 紫外線照射後のDH試験における酢酸発生メカニズムの解明
- ✓ EVA封止材中の酢酸濃度と滞留時間がコンタクト抵抗増加に及ぼす影響の評価

謝辞

本研究の成果は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託研究で得られたものである